

## Crystal Grower -FF CZ150의 자동 직경 제어기 설계

양승현\*, 박종식\*, 이석원\*

\*호서대학교 정보제어공학과

## Design of Automatic Diameter Controller for Crystal Grower-FF CZ150

Seung-Hyun Yang\*, Jong-Sik Park\*, Suk-Won Lee\*

\*Dept. Information & Control Eng. Hoseo Univ

### 요약

본 연구에서는 실리콘 웨이퍼 제조 현장에서 사용 중인 단결정 실리콘 성장기의 자동 직경 제어기를 2계 근사 모델을 이용하여 설계하고 시간지연 보상기를 적용함으로써 결정봉의 직경과 인상 속도를 최적화하여 결정봉의 제품에 직접적인 영향을 주는 결정 결합 및 언더나 오버의 직경 이상을 줄이고 제품의 질과 수율을 향상시킬 수 있다. 또한 기존의 자동직경제어시스템의 고전적인 제어기를 보완함으로써 결과적으로 생산량 증가 및 제품의 질 향상에 이바지를 하고 새로이 요구되는 고객의 신기술 요구에 대한 현장비의 제한성을 극복하는데 큰 기여를 할 것으로 기대 된다.

### 1. 개요

단결정 실리콘 성장기(Crystal Grower -FF CZ150)는 밀폐된 석영 도가니내의 다결정 실리콘을 고 진공 하에서 1450 °C 이상으로 가열 용융시킨 후, 단결정 실리콘의 핵(Seed)을 접촉시켜 봉상의 단결정 실리콘을 주어진 설정치에 따라 자동적으로 성장시키는 장비이다. 그림1은 단결정 실리콘 성장기의 구성도를 나타내고 있다.

단결정 성장 방법은 MCZ성장기법을 이용하고, 챔버 내부는 진공 상태로 알곤(Ar) 가스가 공급되는 성장 환경에서 단결정 직경이 8인치 또는 12인치인 단결정 봉을 만들어 낸다. 단결정 실리콘 성장기는 자동 직경 제어와 온도 제어에 의해서 단결정봉을 생성하게 된다. 특히 단결정 봉의 직경과 성장 속도가 관련된 제어 성능은 결정 성장중 발생하는 결합에 직접적인 영향을 준다. 단결정 실리콘 성장기의 자동 직경제어 시스템은 이미지센서에 의해 피드백 제어되

고 있다. 현재 생산 현장에 적용하는 PD 제어기는 간단한 구조 및 비교적 좋은 제어성능을 가지고 있지만 제어대상 및 제어기의 매개변수에 크게 의존하는 단점을 가지고 있다. 본 논문에서는 적분기를 포함한 긴 시간지연을 가지는 플랜트인 단결정 실리콘 성장기의 자동 직경 제어시스템(Automatic Diameter Control)에 2계 근사화 모델에 근거한 PID 제어기 설계 방법을 적용하여 성능 개선이 이루어짐을 보인다. 또한 Watanabe가 제안한 변형된 스미스 예측기를 적용하여 적분기를 포함한 시스템에 시간지연 보상기를 가지는 구조로 부하 외란 입력에 대한 응답 특성이 개선된 자동직경 제어 시스템을 설계하여 현재 산업 현장에서 사용 중인 단결정 실리콘 성장기(Crystal Grower -FF CZ150)의 자동 직경 제어 시스템에 적용하였다. 본 실험을 통해 결정봉의 직경과 인상 속도를 최적화하여 제어함으로써 결정봉의 제품에 직접적인 영향을 주는 결정 결합 및 언더나 오버의 직경 이상을 줄임으로써 제품의 질과 수

수율을 향상시킬 수 있다.

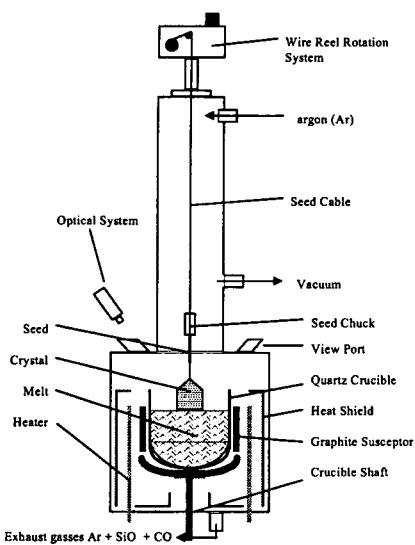


그림 1. 단결정 실리콘 성장기의 구성도 (FF-CZ150)

또한 기존의 자동직경제어시스템의 고전적인 제어기를 보완함으로써 결과적으로 생산량 증가 및 제품의 질 향상에 이바지를 하고 새로이 요구되는 고객의 신기술 요구에 대한 현 장비의 제한성을 극복하는데 큰 기여를 할 것으로 기대 된다.

## 2. 시스템 구성

단결정 실리콘 성장기(Crystal Grower -FF CZ150) 자동직경 제어 시스템은 밀폐된 석영 도가니 내의 다결정 실리콘을 고진공하에서 1450°C 이상으로 가열 용융 시킨후, 단결정 실리콘의 핵(Seed)을 접촉시켜 봉상의 단결정 실리콘을 성장시키는 장비의 핵심이 되는 제어기로 석영도가니 내에 원재료인 Poly-Si과 Dopant를 넣고 단결정 실리콘 성장기내에 있는 전기로의 온도를 높이면 석영도가니내의 Poly-Si이 완전히 녹은 Melt 상태가 되는데 이때의 온도는 1450°C 정도가 된다. 석영도가니의 온도를 균일하게 유지시키기 위해 도가니를 회전시킨다. Melt의 표면에 종자(Seed)를 접촉시켜 Dipping 작업을 하는데 Seed 주위에 밝은 환형이 나타나고 이것을 Meniscus

라고 부른다. 이는 액체 상태의 실리콘과 고체 상태의 실리콘 Seed 사이의 접촉면의 가장자리의 상태를 정확히 파악하여 좋은 단결정 실리콘을 성장시킬 수 있게 한다.

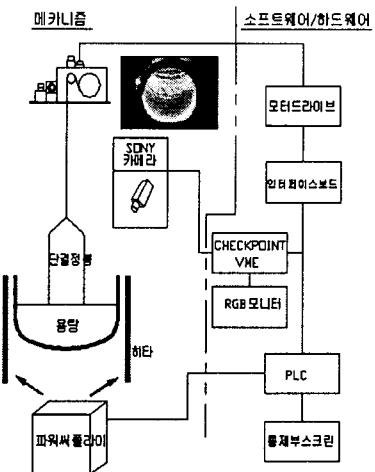


그림 2. 자동 직경 조정 시스템

논문에 적용된 CZ-150 Crystal Grower에서는 이 Meniscus를 Machine Vision System에서 성장되는 Ingot의 직경을 측정하게 된다. Meniscus가 양호한 상태에서 Seed를 회전, 인상시키면 단결정 실리콘이 Seed의 결정 방향대로 성장이 되는데 인상속도에 따라 직경의 크기가 결정된다. 자동직경제어는 두 스텝으로 나누어 초반부는 Machine Vision System에서 측정되는 Ingot의 직경을 피드백 하여 Ingot의 인상 속도를 PD 제어로 조절하며 Body Length 100mm이 후부터는 Ingot의 인상속도를 고정하고 석영도가니에 가해지는 Heater의 Power를 제어하여 성장을 하게 된다.

## 3. 제어기의 설계 및 적용

### 3.1 PID 제어기의 설계와 시뮬레이션

시간지연이 포함된 고차 시스템(high-order system)을 저차 시스템으로 근사화 하는 방법을 이용하여 제어기를 설계한다. 주파수 응답을 이용하여 시간 지연 항을 포함한 2계 근사 모델  $G(s)$ 은 플랜트의 주

파수 응답 중 단지 두 점만을 이용하여 다음과 같은 2계 근사화 모델을 고려한다.

$$G(s) = \frac{e^{-sL}}{as^2 + bs + c}$$

a, b, c, L의 값들이 2계 근사화 모델에서 계산하여야 하는 파라미터들이며, 이를 결정하기 위해 주파수 응답의 위상이 만족하는 두 개의 주파수 포인트  $s=j\omega_c$ ,  $s=j\omega_b$ 를 선정한다.

$$\angle G(j\omega_c) = -180, \angle G(j\omega_b) = -90$$

이때,  $G(j\omega_c) = \overline{G(j\omega_b)}$ ,  $G(j\omega_b) = \overline{G(j\omega_c)}$  라고 두면

$$c - a\omega_c^2 + jb\omega_c = \frac{\cos(\omega_c L) - j\sin(\omega_c L)}{-|G(j\omega_c)|}$$

$$c - a\omega_b^2 + jb\omega_b = \frac{\cos(\omega_b L) - j\sin(\omega_b L)}{-j|G(j\omega_b)|}$$

위의 두 식으로부터 a, b, c의 관계식과 Newton-Raphson 방법을 이용 근사화된 L를 구할 수 있다. 프로세서의 전달함수  $G(s)$  또는 주파수 응답  $G(j\omega)$ 가 유용하고 피드백 제어기의 구성을 일반적인 형태의 폐루프 구조로 가정하고 PID 제어기의 식을 다음의 형태로 구성한다.

$$K(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D s$$

위 식으로부터 형태를 바꾸어 쓰면 다음과 같이 표현된다.

$$K(s) = k \left( \frac{As^2 + Bs + C}{s} \right)$$

여기서  $A = (K_D/k)$ ,  $B = (K_I/k)$ ,  $C = (K_I/k)$ 이다.

개루프 전달함수  $G(s)K(s)$ 의 결과는 다음과 같이 근사화 된다.

$$G(s)K(s) = \frac{k}{s} e^{-sL}$$

폐루프 시스템의 극점들은 적절한 k의 값을 지정함으로 loop의 균형성을 가지고 선택할 수 있다.

단결정 실리콘 성장기의 자동직경 시스템의 모델식은 다음과 같다.

$$G(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)} e^{-sL}$$

여기서 시간지연  $L=8\text{min}$ ,  $\tau=2\text{min}$ ,  $K=0.9$  이고, 전체 시스템의 피드백 계인  $H(s)=12/345$  이다.[1]  $\omega_c=0.1624\text{rad/s}$ 와  $\omega_b=0.001\text{rad/s}$ 의 두점에서 이고  $G(j\omega_c)=-0.1832\text{rad/s}$  와  $G(j\omega_b) = -31.2984$ 에 각각 정해진다. Newton-Raphson의 방법에 의해 모델은 다음과 같이 추정된다.

$$G(s) = \frac{1}{65.7513s^2 + 31.8819s + 0.000311} e^{-7.6840s}$$

자동 직경 제어 시스템의 PD제어기는 다음과 같다.

$$K(s) = \frac{6s^2 + 2.7s}{s}$$

80분에서 -0.05의 부하 외란을 주었을 때 그림3에서처럼 부하 외란에 대해 4.8%의 오차를 가지고 있다. 이 방법은 플랜트가 적분기를 포함하는 경우 정상상태의 오차가 발생하기 때문에 외란에 대해 만족할 만한 성능을 얻기가 어렵다.

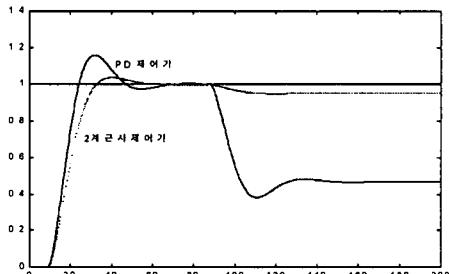


그림3. 2계 근사제어기의 단위 계단응답

### 3.2 시간 지연 제어기설계와 시뮬레이션

그림4는 근사화 모델의 PID를 이용한 시간 지연 제어기의 구조이다.  $R(s)$ 는 기준입력을,  $Y(s)$ 는 출력을,  $D(s)$ 는 외란을 각각 나타내며,  $C(s)$ 는 주 제어기이고  $M(s)$ 는 외란에 대한 보상기이다.

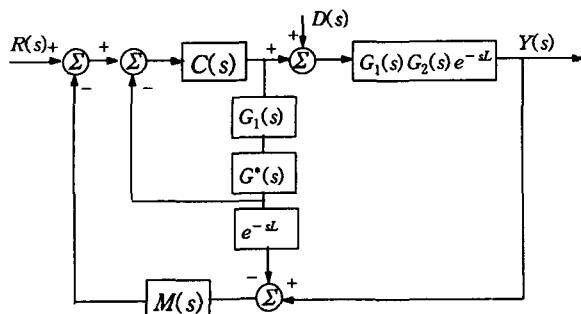


그림4. 시간 지연 제어기

적분요소를 갖는 시간지연 플랜트의 모델식은

$$G(s) = \frac{1}{(\tau s + 1)} \frac{K}{s} e^{-sL} = G_1(s) G_2(s) e^{-sL}$$

$$G_1(s) = \frac{1}{(\tau s + 1)}, \quad G_2(s) = \frac{K}{s}, \quad G^*(s) = \frac{K}{s + \alpha}$$

#### 시간지연 보상기

$$M(s) = \frac{as + b}{s + \mu}$$

제안된 시간 지연 제어기는 적분기를 포함함으로 2계 근사화 모델을 이용한 PID제어기로부터  $K_1$  값을 제어기의 적분기 값으로 사용을 할 수 있으나 이하 일 경우에는 0.1을 사용하여 시간 지연 제어기의  $C(s)$ 를 구한다.

$$C(s) = \frac{4.2785s^2 + 2.0746s + 0.1}{s}$$

$\alpha = 0.0000203$ 로 놓고,

$$G^*(s) = \frac{K}{s + \alpha} = \frac{K}{s + 0.0000203}$$

$b = \mu = 1$ 로 하여 시간지연 보상기  $M(s)$ 를 구하면

$$M(s) = \frac{8.9992s + 1}{s + 1}$$

그림5에서는 2계 근사모델의 PID 제어기의 파라미터를 이용하고 시간지연 보상기  $M(s)$ 를 추가한 구조의 시간지연 제어기의 기준 입력 및 부하 외란에 대한 응답 특성이 개선되는 것을 확인할 수 있다.

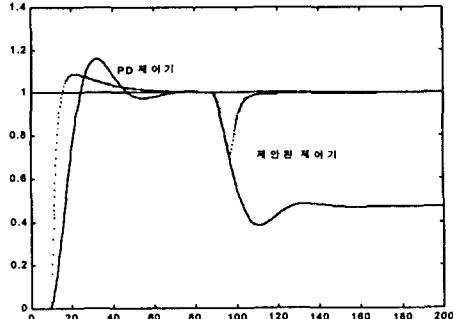


그림5. 제안된 제어기의 단위 계단응답

#### 4. 결 론

본 논문에서는 2계 근사화 모델을 이용한 PID 제어기를 설계하여 오버슈트와 정상상태 오차를 줄였으며 시간 지연 보상기를 적용함으로써 기준입력 및 부하 외란에 대한 응답 특성을 향상 시켰다. 본 논문에서 적용한 CZ-150 Crystal Grower에서 적용하여 결정봉의 직경과 인상 속도를 최적화하여 제어함으로써 결정봉의 제품에 직접적인 영향을 주는 결정 결함 및 언더나 오버의 직경 이상을 줄임으로써 제품의 질과 수율을 향상시킬 수 있다.

#### 【참 고 문 헌】

- [1] Massoud Amin, S. L . Kimbel : Next Steps in Process Modeling and Controller Design for Crystal Growth, Washington University in St. Louis CT-5-94-1, 21 pp. 1994
- [3] Q. G. Wang, T. H. Lee, h. W. Fung, Q. Bai, and Yu Zang "PID Tuning for Improved Performance", IEEE Trans. Contr. syst. Technol., vol. 7, pp. 457-465, 1999
- [4] K. Watanabe " A New Modified Smith Predictor Control for Time-Delay Systems with an Integrator", Proc. 2nd Asian Contr. Conf., Vol.3, pp. 127-130, 1997